

06.2:07

Частотно-перестраиваемый полупроводниковый WGM-лазер ($\lambda = 2.35 \mu\text{m}$), работающий при комнатной температуре

© А.Н. Именков, В.В. Шерстнёв, М.А. Сиповская, А.П. Астахова,
Е.А. Гребенщикова, А.М. Монахов, К.В. Калинина, G. Boissier,
R. Teissier, А.Н. Баранов, Ю.П. Яковлев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Institut d'Electronique du Sud (IES), Université Montpellier 2, CNRS, IES
(UMR CNRS 5214), 34095 Montpellier, France
E-mail: v.sherstnev@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 17 апреля 2009 г.

Исследована частотная перестройка WGM-лазера ($2.35 \mu\text{m}$) с секторным резонатором. Обнаружено, что в процессе протекания импульса тока длительностью до $1.2 \mu\text{s}$ наблюдается плавная перестройка длины волны излучения основной моды в длинноволновую сторону на 30 \AA при комнатной температуре, что больше межмодового расстояния в 1.4 раза.

PACS: 85.30.z, 42.79-e, 42.55.Px

В диапазоне 1.8 – $2.4 \mu\text{m}$ лежат обертоны и комбинированные переходы в молекулах ряда веществ (H_2O , CH_4 , NO_2 , N_2O , C_2H_4 и др.) [1]. Поэтому создание диодных лазерных спектрометров высокого разрешения для этой спектральной области является перспективной задачей [1].

В спектральном диапазоне 1.8 – $2.4 \mu\text{m}$ прежде создавались перестраиваемые по частоте диодные лазеры полосковой конструкции [2]. В таких лазерах с резонатором Фабри–Перо диапазон перестройки отдельной моды меньше межмодового интервала и составляет 4 – 16 \AA .

В последние годы интенсивно развиваются исследования по созданию WGM-лазеров, генерирующих излучение в средней ИК-области спектра (2 – $4 \mu\text{m}$) на основе мод шепчущей галереи (whispering gallery mode, сокращенно — WGM) [3–6]. Такие лазеры привлекательны

большой добротностью резонатора и низкими значениями порогового тока по сравнению с полосковыми лазерами.

В литературе отсутствуют сведения об исследовании частотной перестройки полупроводниковых WGM-лазеров.

Цель настоящей работы — создание и исследование частотно-перестраиваемого инфракрасного полупроводникового WGM-лазера на длину $2.35\text{ }\mu\text{m}$, работающего при комнатной температуре.

Для решения поставленной задачи была выращена структура методом молекулярно-пучковой эпитаксии на установке RIBER Compact 21E на подложке GaSb (100) *n*-типа. Активная область общей толщиной 850 nm состояла из двух напряженных квантовых ям состава $\text{Ga}_{0.65}\text{In}_{0.35}\text{As}_{0.11}\text{Sb}_{0.89}$, каждая толщиной 10 nm, разъединенных слоем 30 nm состава $\text{Al}_{0.25}\text{Ga}_{0.75}\text{As}_{0.02}\text{Sb}_{0.98}$. Волноводные слои, изготовленные из $\text{Al}_{0.25}\text{Ga}_{0.75}\text{As}_{0.02}\text{Sb}_{0.98}$, имели толщину по 400 nm. Активная область преднамеренно не легировалась. Волновод был ограничен широкозонными слоями *p* (Be)- и *n* (Te)- $\text{Al}_{0.9}\text{Ga}_{0.1}\text{As}_{0.08}\text{Sb}_{0.92}$ толщинами по $1.0\text{ }\mu\text{m}$. С внешней стороны широкозонных слоев были выращены два тонких, по 100 nm варизонных слоя AlGaAsSb для улучшения инжекции носителей заряда в активную область. Верхний контактный слой GaSb *p*-типа имел толщину 475 nm и был легирован до концентрации дырок $5 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. Более подробно процесс выращивания лазерной структуры описан в [7].

Из созданных структур изготавливались лазерные чипы с резонатором в форме диска диаметром $200\text{ }\mu\text{m}$ и высотой $15\text{ }\mu\text{m}$ методом фотолитографии и химического травления.

Омические контакты к полупроводнику создавались методом термического вакуумного напыления с взрывной фотолитографией. Для этого на эпитаксиальный слой наносили последовательно металлы и сплав Cr–Au:Zn–Au. Контакт лазерного чипа представлял собой кольцо шириной $30\text{ }\mu\text{m}$ с внешним диаметром $180\text{ }\mu\text{m}$ и отстоял от края резонатора на $10\text{ }\mu\text{m}$ (рис. 1). Со стороны подложки также методом термического вакуумного напыления наносился сплошной многослойный Cr–Au:Te–Au контакт. После напыления структура подвергалась термообработке в среде водорода для сплавления металлических слоев. Из полученных чипов методом раскалывания изготавливались симметричные лазерные кристаллы с резонаторами в форме полудиска. Кристалл припаивался на корпус TO-18 индием. Излучение собиралось параболическим отражателем.

^{4*} Письма в ЖТФ, 2009, том 35, вып. 18

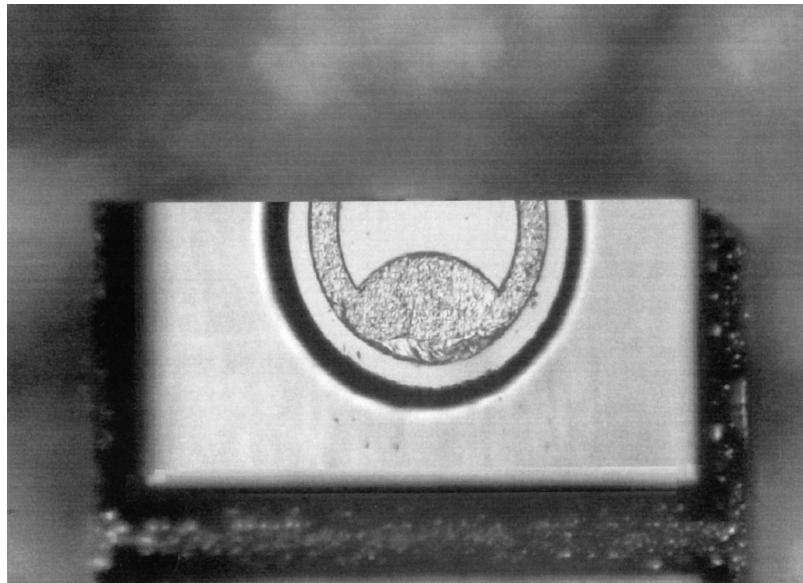


Рис. 1. Микрофотография чипа WGM-лазера с резонатором в форме полудиска (вид сверху).

Была собрана и измерена серия лазеров с резонатором в форме полудиска. Все они имели диодные характеристики с напряжением отсечки ~ 0.6 V при комнатной температуре и дифференциальным сопротивлением 0.8–1.0 Ω .

Для излучения модовой структуры спектров лазеров использовался спектрометр марки ДФС-32 с неохлаждаемым фоторезистором PbS в качестве фотодетектора. Спектры снимались с разрешением 2 Å.

Спектры излучения WGM-лазерных диодов исследовались при комнатной температуре (295 K) и различных импульсных токах амплитудой от 200 до 600 mA. На лазеры подавались импульсы длительностью от 0.1 до 1.2 μ s, следовавшие с частотой 20 kHz. Питание прерывалось с частотой 421 Hz и заполнением 0.5. Световой сигнал на выходе спектрометра синхронно детектировался на частоте прерывания. Продетектированный спектральный сигнал оказывался пропорциональным средней интенсивности излучения на данной длине волны.

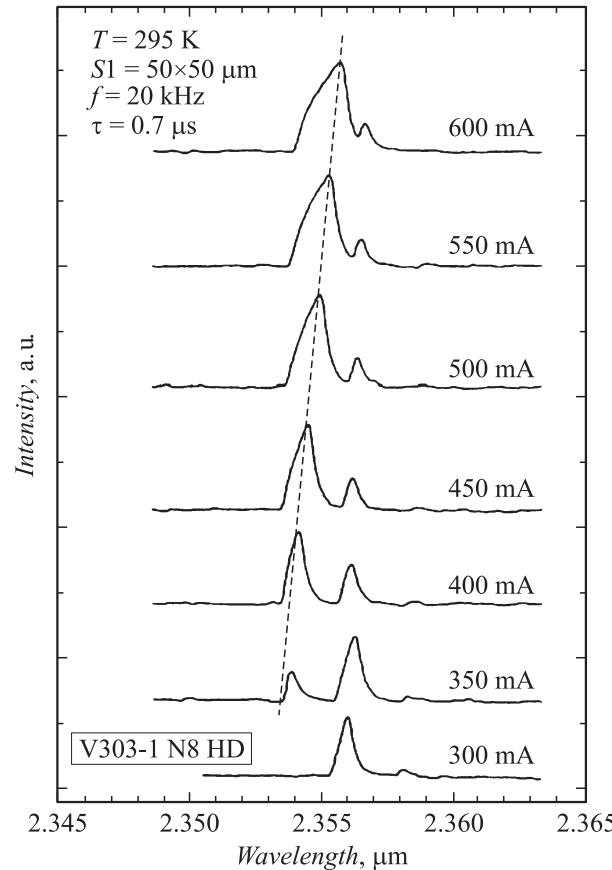


Рис. 2. Спектры излучения частотно-перестраиваемого лазера (спектральное разрешение 2 \AA) с резонатором в виде половины диска, измеренные при различной величине тока накачки, длительности импульсов $0.7 \mu\text{s}$ и частоте повторения 20 kHz при комнатной температуре.

На рис. 2 показаны спектры когерентного излучения лазера с резонатором в виде полудиска в интервале токов 300–600 mA. Длительность импульса тока, измеренная на экране осциллографа, составляет $0.7 \mu\text{s}$. Видно, что излучение имеет многомодовую периодическую

структурой. Поскольку активная область лазера нагревается в течение импульса тока и моды смещаются в длинноволновую сторону, то приведем начальные длины волн каждой моды, отсчитанные на коротковолновой границе ее спектра. При токе 300 mA, как и на пороге генерации ($I_{th} = 240$ mA), преобладает мода с длиной волны $\lambda = 2.3555$ μm . Имеется и более длинноволновая мода с $\lambda = 2.3578$ μm . Но при токе 350 mA появляется еще более коротковолновая мода $\lambda = 2.3534$ μm , которая при дальнейшем увеличении тока становится преобладающей. Появление более коротковолновых мод с увеличением тока объясняется увеличением уровня возбуждения лазера с ростом тока и несущественностью влияния нагревания лазера средним током. Экспериментально определенное расстояние между упомянутыми модами в среднем составляет ~ 22 Å. Это согласуется с расчетами по формуле для межмодового расстояния мод шепчущей галереи в полудисковом резонаторе [5] $d\lambda_{WGM} = \frac{\lambda^2}{2\pi Rn}$, где $R = 100$ μm — радиус резонатора, $n = 4.0$ — эффективный коэффициент преломления света в волноводе ($d\lambda_{cal} = 22$ Å). На основании удовлетворительного согласия расчетных и экспериментальных данных можно сделать вывод, что лазер с полудисковым резонатором работает на модах шепчущей галереи.

Обращает на себя внимание уширение спектра преобладающих коротковолновых мод в длинноволновую сторону с ростом тока, превышающее на порядок разрешающую способность спектрометра. Это можно объяснить тем, что активная область лазера нагревается в процессе действия импульса тока, давая плавное увеличение коэффициента преломления в волноводе и соответствующее увеличение длины волны собственных мод резонатора. В результате преобладающая мода плавно смещается в длинноволновую сторону в процессе импульса тока, т. е. наблюдается частотная перестройка лазера на основной моде. Слабые длинноволновые моды почти не перестраиваются и не уширяются, так как они генерируются только на переднем фронте импульса протяженностью 0.2 μs , когда ток ≤ 350 mA, а на плато импульса они не генерируются. На плато импульса генерируется фактически только одна мода, т. е. лазер является одномодовым.

На рис. 3 показаны зависимости длины волны (λ) преобладающей коротковолновой моды, измеренной в максимуме спектра, от длительности импульса тока (τ). Это значение λ достигается в конце плато им-

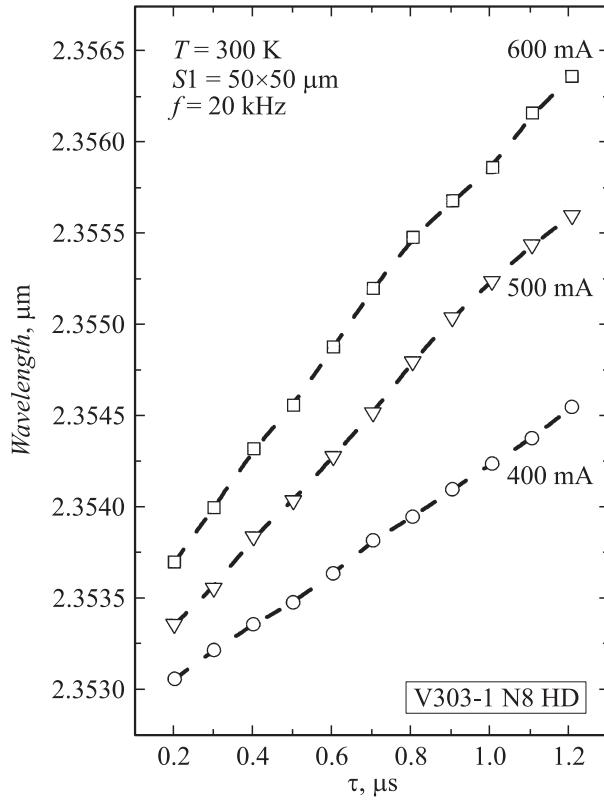


Рис. 3. Зависимость максимальной длины волны основной моды лазера от длительности импульса тока при различных токах.

пульса тока. При всех значениях тока λ увеличивается с ростом τ почти линейно. Экстраполяция зависимости λ от длительности импульса тока к нулевому значению τ показала, что начальные λ в момент включения тока фактически совпадают при разных токах. Увеличение длины волны в процессе импульса тока приводит к уширению спектра основной моды, отмеченному на рис. 2. Крутизна изменения λ с τ (рис. 3) тем больше, чем больше ток. При этом она пропорциональна превышению тока над пороговым значением. Вероятно, нагревание резонатора в

основном происходит за счет джоулева тепла, выделяющегося при протекании тока, и за счет поглощения лазерного излучения высокой плотности, сосредоточивающихся вблизи края диска. Ширина области сосредоточения составляет величину $\sim 2\lambda$, согласно расчетам [6].

При токе 600 mA и длительности импульса 1.2 μ s длина волны изменяется на 30 Å, что превышает межмодовое расстояние в ~ 1.4 раза. По оценкам резонатор лазера при этом нагревается на 30 K. Столь большое изменение длины волны объясняется тем, что роль неравновесных носителей заряда в дисковом квантово-размерном лазере несущественна.

Достигнутое изменение длины волны излучения 30 Å позволяет считать WGM-лазер с резонатором в форме полудиска перспективным для создания портативных диодных лазеров спектрометров.

Таким образом, исследована частотная перестройка при комнатной температуре WGM-лазера с полудисковым резонатором (2.35 μ m) при импульсном питании в интервале токов 200–600 mA в зависимости от длительности импульса (0.1–1.2 μ s). Показано, что с увеличением длительности импульса от 0.1 до 1.2 μ s наблюдается перестройка длины волны излучения коротковолновой моды в длинноволновую сторону на 30 Å, что больше межмодового расстояния в 1.4 раза.

Авторы благодарят Е.В. Кузнецова и Н.В. Власенко за помощь в работе.

Работа частично поддержана грантами РФФИ 07-02-92170-НЦНИ_a и 08-02-90039-Бел_a и программой президиума РАН № 27 „Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов“.

Список литературы

- [1] Надеждинский А.И. // ДЛС-10. Десятый общероссийский семинар по диодной лазерной спектроскопии. 2008. <http://www.dls.gpi.ru/rus/sem/10/Nad.pdf>.
- [2] Астахова А.П., Баранов А.Н., Висе А., Именков А.Н., Колчанова Н.М., Стоянов Н.Д., Черняев А., Ярхва Д.А., Яковлев Ю.П. // ФТП. 2003. Т. 37. В. 9. С. 502–507.
- [3] Sherstnev V.V., Krier A., Monakhov A.M., Hill G. // Electron. Lett. 2003. V. 39. P. 916–918.
- [4] Шерстнёв В.В., Монахов А.М., Астахова А.П., Кислякова А.Ю., Яковлев Ю.П., Аверкиев Н.С., Krier A., Hill G. // ФТП. 2005. Т. 39. В. 9. С. 1087–1092.

- [5] Monakhov A.M., Sherstnev V.V., Astakhova A.P., Yakovlev Yu.P., Boissier G., Teissier R., Baranov A.N. // Appl. Phys. Lett. 2009. V. 94. P. 051102.
- [6] Yarekha D.A., Glastre G., Perona A., Rouillard Y., Genty F., Skouri E.M., Boissier G., Grech P., Joullie A., Alibert C., Baranov A.N. // Electron. Lett. 2000. V. 36. N 6. P. 537–539.
- [7] Averkiev N.S., Sherstnev V.V., Monakhov A.M., Grebenishikova E.A., Kislyakova A.Yu., Yakovlev Yu.P., Krier A., Wright D.A. // Low Temperature Physics. 2007. V. 33. N 2–3. P. 283–290.